

## 식약처, 차세대 위해성평가 심포지엄 개최

- 혁신, 조화, 소통을 주제로 싱가포르, 일본과 최신 기술동향 교류
- 신기술(NAMs)을 활용한 식품안전평가기술 고도화 방안 모색

식품의약품안전처(처장 오유경) 식품의약품안전평가원(원장 강석연)은 오는 7월 1일 대전컨벤션센터(대전광역시 유성구 소재)에서 「혁신, 조화, 그리고 소통」을 주제로 ‘차세대 위해성평가 심포지엄’을 개최한다.

이번 심포지엄은 「2026 한국식품과학회 정기학술대회」 중 특별 세션으로, 차세대 위해성평가(NGRA)\*의 최신 국제 동향을 공유하고 미래 발전방향을 모색하기 위해 마련됐다.

\* **NGRA(Next-Generation Risk Assessment)**: 전통적 동물시험에 의존하던 방식에서 벗어나, 최신 과학기술(인실리코, 오믹스 등)을 이용하여 인체 위해성을 평가하는 체계

최근 글로벌 식품공급망 변화와 신규 화학물질의 증가 등으로 보다 신속하고 효율적인 식품 안전관리체계의 중요성이 커지고 있다. 이에 식약처는 기존 동물실험 중심 평가체계의 한계를 보완하기 위해 컴퓨터 기반(*in silico*)\* 유해물질 위해예측 모델 개발 등 차세대 위해성평가 기술 연구를 추진하고 있다.

\* **In silico (인실리코)**: 컴퓨터 모델링과 AI 알고리즘을 이용하는 기술(예: QSAR모델)

이번 심포지엄에서는 싱가포르와 일본의 전문가들이 참여해 식품 안전평가 분야의 신기술(NAMs)\* 적용 사례와 정책 추진 현황을 공유한다. 또한 식품분야 차세대 위해성평가 도입을 위한 선결과제와 위해소통 방안도 논의할 예정이다.

\* **NAMs(New Approach Methodologies)**: 차세대 위해평가를 구현하기 위해 활용되는 새로운 기술들의 통칭(예: 인실리코, 인비트로, 오믹스 기술 등)

아울러, 이번 행사는 ‘혁신(Innovation), 조화(Harmonization), 소통(Com

munication)’ 이라는 가치를 바탕으로 아시아 국가 간 협력을 강화하고, 글로벌 규제조화를 위한 위해평가 혁신기술 활용 방안을 모색하는 교류의 장이 될 것으로 기대된다.

식약처는 앞으로도 보다 신속하고 정밀한 위해평가 기술을 기반으로 과학적 식품 안전평가 체계를 구축하여 국민이 신뢰할 수 있는 안전한 식생활 환경 조성에 최선을 다할 계획이다.

담당 부서	식품의약품안전평가원 식품위해평가과	책임자	과 장	이혜영 (043-719-4502)
		담당자	연구관	김방현 (043-719-4517)



2026 한국식품과학회 정기학술대회 세션 (GS06)

# 차세대 위해성 평가: 혁신, 조화, 그리고 소통

Next-Generation Risk Assessment:  
Innovation, Harmonization, and Communication

- 일시 '26. 7. 1(수) 15:10 ~ 17:20
- 장소 대전 컨벤션 센터(107호)

## 주제발표

15:20 ~ 15:50

### 식품안전평가를 위한 NAMs의 적용: 싱가포르의 관점

Adopting New Approach Methodologies (NAMs)  
for food safety assessment: a Singapore Perspective

Wei Ning Chen 교수  
(Nanyang Technological University Singapore)

15:50 ~ 16:20

### NAMs를 활용한 식품안전평가의 고도화: NGRA 및 Read-across 적용

Enhancing food safety assessment with NAMs:  
Toward NGRA and read-across applications

Yumi Ahahori 박사  
(Chemicals Evaluation and Research Institute, Japan)

## 종합토론

16:20 ~ 17:10

### 차세대 위해성 평가 워크숍

NGRA Workshop

좌장: 전형숙 중앙대학교 교수

#### 패널토론

이해영 식품위해평가과 과장  
백해진 한양대학교 교수  
이종현 EH R&C 대표  
윤해정 중앙대학교 교수